中国激光

第11卷 第5期

光纤通信用 GaAs-GaAlAs DH LED 的 高频调制特性

詹 素 真 (重庆光电研究所)

提要:分析了器件的两种高频调制特性,给出了测量结果——数据和曲线。讨论 了器件在不同信号调制下的 P-I、V-I 曲线线性范围和调制带宽,由此确定器件的 合适工作点。

High frequency modulation characteristics of GaAs–GaAlAs DH LEDs for optical fiber communication

Zhan Suzen

(Chongqing Opto-electronics Research Institute)

Abstract: The high frequency modulation characteristics of GaAs-GaAlAs DH LEDs are analyzed and the results (data and curves) presented. Also discussed are the linear range and modulation bandwidth for P-I, V-I curves as the devices are modulated by various signals, and the optimum operation point of the device can thus be determined.

一、理论依据

半导体 DH LED 的调制带宽主要受异 质结处的空间电荷区电容 C、微分电阻 R 构 成的时间常数和注入到有源区中的载流子寿 命所限制。注入电流 I 足够大时,可以忽略 电容等引起的寄生效应^[4]。在恒定的调制电 流下,器件的输出光功率随调制电流角频率 ω的变化如下^[1]:

$$P(\omega) = \frac{P_{\theta}}{[1 + (\omega\tau)^2]^{1/2}}$$
(1)

式中 P_e是在同样幅度直流电流下的输出光

功率, 7 是器件的注入载流子寿命, 且有:

 $\tau = \tau_r + \tau_{nr} \tag{2}$

式中, *τ*, 是辐射复合寿命, *τ*, 是非辐射复合 寿命。对 DH LED 而言,由于损耗在非辐射 复合过程中的载流子很少,故可认为:

$$\tau \approx \tau_r \tag{3}$$

调制带宽一般被定义为探测器检测的电 功率的一半时的频率^[2,4],根据(1)式得:

$$\Delta f = \frac{1}{2\pi\tau} \tag{4}$$

另一种定义是输出光功率下降至零调制频率的一半时的频率^[2],则依(1)式得:

收稿日期: 1983年4月5日。

. 283 .

$$\Delta f' = \frac{\sqrt{3}}{2\pi\tau} \tag{4}'$$

在 P 型有源区中, τ 可表示为^[2]: $\tau = \frac{-BP_0 qd + \sqrt{(BP_0 qd)^2 + 4BJ qd}}{2BJ}$ (5)

式中 B 是复合常数, P₀ 是有源区空穴浓度, d 是有源层厚度, J 是注入电流密度。

应该指出,上述公式的推导都是在忽略 了光子寿命 τ_p 的情况下进行的。因为在 GaAs半导体发光器件中 τ_p 值很小, $\tau/\tau_p=$ 10³~10⁵,在实际计算中可忽略 τ_p 的影响。

对于一定结构参数的器件,在某一环境 温度下,其最大耗散功率和最大注入电流之 间的关系是^[3]:

$$I_{\max,t} = \frac{P_{\max,t}}{V_{F,\max,t_{*}}} \tag{6}$$

式中t是环境温度, t_{25} 是室温 25°C 下, $V_{F,\max,t_{25}}$ 表示 25°C 下器件最大正向工作电压。

一个实际的 DH LED, 其电流-电压关 系特性可表示为:

 $I = I_{s0} \{ \exp[e(V - IR_s)/akT] - 1 \}$ (7) 式中 I_{s0} 是饱和电流, $1 \le a \le 2$, V 是器件两 端的电压。

根据自发发射的光-电流关系得出^{□□}: 低电流注入下,

 $P_{a} \propto I$

 $P_{\theta}^2 \propto I \tag{8}$

高电流注入下,

(9)

二、实 验

1. 样品

实验中所用器件为 Burrus 表面发射型, 晶片用液相外延方法制成,具有四层结构。其 制作方法是: 在 n 型 GaAs 衬底上依次液相 外延生长 n-Ga_{0.7} Al_{0.3} As 限 制层 (Te, 5× 10¹⁷~1×10¹⁸厘米⁻³,10~12 微米), *P*-GaAs 有源层 (Si, Ge, 1~2×10¹⁸ 厘米⁻³, 0.6~2 微 米), *P*-Ga_{0.7} Al_{0.3} As 限 制层 (Ge, 1×10¹⁷ 厘米⁻³~1×10¹⁸ 厘米⁻³, 2微米), *n*-GaAs 顶层 (Te, 2~6×10¹⁸ 厘米⁻³, 1~2微米)。 利用 *p*-*n* 结隔离 Zn 扩散 沟 通 技术,形成 ϕ 50 微米的电流注入区(面积*S*=1.96×10⁻⁵ 厘米²),通过光刻腐蚀法在衬底上形成出光 洞。器件管芯 *P* 面朝下热焊在镀 Au 的无氧 铜管座上,*n* 侧用金丝焊接形成电接触。与 光纤耦合的器件带有 Si PIN 光电二极管 监 视输出(即把 LED 与 PIN 封装在一个管壳 中),使用方便。

用不同外延片制作 25 只样品,通过 P-I、V-I曲线及近场、光谱等特性测量和 寿命实验筛选,选用其中 10 支做测量用。器 件在 $I_b=100$ 毫安下输出光功率 1~4 毫瓦, 峰值 波 $\aleph_p=8300 \sim 8900$ Å, 谱 线 半 宽 $\Delta \lambda$ = 400~550 Å, 截止频率 $f_c \ge 15$ 兆赫, 工 作 寿命 >1×10⁴ 小时。 与 ϕ 50 微米阶跃光纤 耦合后,尾纤光输出功率 ≥100 微瓦,最高达 300 微瓦左右。

2. 系统

DH LED 的高频调制特性,可采用二种



 (a)正弦调制法测试系统示意图
1—XFG-7 高频信号发生器; 2—SBM-14 示 波器; 3—LED 测试盒; 4—接收盒 (SiPIN)
5—DW2 宽带电压表; 6—直流偏置电源; 7—直流稳压源



(b) 脉冲调制法测试系统示意图 1—MFD-1A 毫微秒信号发生器; 2—LED 测试 盒; 3—SiRAPD; 4—直流偏置电源; 5—双通 道 500 兆赫宽带示波器

图 1

. 284 .

方法测量,一是方波脉冲调制法,二是正弦波 调制法。前者不需预先加直流偏置,后者的 正弦信号叠加在预偏的直流信号上。图1(a) 为正弦调制法测试系统示意图,图1(b)为脉 冲调制法测试系统示意图。测试时需十分注 意整个回路的阻抗匹配。

三、结 果

1. 脉冲调制法

图 2(a)、(b)为样品 GF211-A2[#]在脉冲 调制下测到的 t_r - I_p 和 f_o - I_p 关系曲线。从 图可见,在50~500 毫安的脉冲峰值电流下, t_r 随 I_p 增加而近指数衰减,而 $f_c 与 I_p$ 的 $\frac{1}{2}$ 次方成比例增加。图 2(b)中的 f_c 值是依 式^[53]:



换算的, 它与正弦调制下测到的 fo 值有些差别。

实验中,注入电流脉冲频率为 300 赫,脉 宽 100 毫微秒, *I*,最大峰值取 500 毫安。图 3 示出了 GF 211-A 20[#] 器件的 *P*,-*I*,关系 曲线。从图可见,在 50~500 毫安电流范围 内, *P*,-*I*,基本为线性关系。

2. 正弦电流调制法

本节叙述不同 *I*_b 和 *I*_m 对器件截止频率 *f*_c 和调制输出光功率 *P*_m 的影响。给出了各 种关系曲线。



图 3 GF211-A20# Pp-Ip 关系曲线

(1) 调制频率 f 和输出光功率 Pm 的关

系

图 4 为 样 管 GF 2114[#] 的 *f*-*P*_m 关 系 曲 线。很明显, *P*_m 随 *f* 的 增加而逐渐下降。定



图 4 GF2114# f-Pm 关系曲线

· 285 ·

义 P_m 下降至最大值一半时所对应的 f 为器 件的截止频率 f_c 。图中 4[#] 器件的 $f_c=18$ 兆 赫,工作点为 $I_b=65$ 毫安, $I_m=30$ 毫安。

(2) 截止频率 fo 与直流偏置电流 Ib 的 关系

图 5 为样管 GF 211-A 20[#] 在恒定调制 电流 I_m 下的 f_{σ} - I_b 关系曲线。图中的六条 曲线分别对应于 I_m 为 5、10、15、20、25、30 毫安。很明显,在同一 I_m 下, f_c 随 I_b 的 1/2 次方近线性增加。



图 5 不同 I_m 下样管 GF 211-A20[#] 的 f_c-I_b 关系

(3) 截止频率 fo 与交流调制电流 I_m 的 关系

在固定 I_b 下, f_c 与 I_m 的关系见图6。 图中示出了样管 GF211-A 20[#] 当 I_b 分别为 30、50、75和100毫安时的 f_c - I_m 关系。从 图可见, I_m 增加, f_c 也增加;同一 I_b 下, f_o 基本上与 I_m 的1/2次方成比例增加。

(4) 调制输出光功率 *P*_m 与调制电流 *I*_m 的关系

图 7 表示样管 GF211 12[#] 在固定 I_b 和 规定调制频率下的 P_m - I_m 关系曲线。图 7(a)、 (b)、(c)、(d) 分别对应于 I_b =30、50、75 和 • 226•





100 毫安。调制频率分别取 1、5、10、15 兆 赫。

从图可见,在某一频率下,当 I_b 固定时, $P_m 与 I_m$ 有良好线性关系;在同一 I_b 和恒定 I_m 下, P_m 随调制频率的增加而减少。

(5) 调制输出光功率和 直流 偏 置 电 流 *I*^b 的关系

在恒定的 I_m 和规定的调制频率下, P_m 与 I_b 关系如图 8(a)、(b)、(c)、(d)、(e), 它分 别对应于 $I_m = 5$ 、10、15、20、25 毫安。

大多数器件, 在同一频率下, 当 I_m 恒定时, P_m 随 I_b 增加而增加, 到某一 I_b 值后 P_m 基本保持不变。一部分P-I 线性较差的器件, 在 $I_b=30\sim70$ 毫安范围内, P_m 随 I_b



图 8 样管 GF211 12[#] 在不同 I_m 和 不同 f 下的 P_m-I_b 关系

增加而增加;而在 $I_b=70\sim100$ 毫安范围内, P_m 则随 I_b 增加而略为下降,个别P-I线性较好的器件也有类似情况。

从图 8 还可看到, 在较大的调制度下 (*M*>90%), *P*_m 值较低, 而在合适的调制度 下, *P*_m 随 *I*_b 增加比较成比例增加。

四、讨 论

1. P-I、V-I 特性的线性区

根据公式(6),对一定结构参数和设计参数(如材料、层厚、掺杂浓度、面积、管壳封装结构)的器件来说,在一定的环境温度下,其最大正向注入电流受最大耗散功率所限制。 对我们研制的器件,根据计算^[3],在25℃下 最大正向直流注入电流至少为200毫安。

从公式 (7) 可见,小电流注入下, $I \propto \exp(eV/akT)$,这时外加电压主要降落 在p-n 结上,当注入电流增加到使外加电压 $<math>V \gtrsim E_g/e$ 时,I-V关系基本为线性,其变化 率 $\frac{\Delta V}{\Delta I} = R_s$ 为一常数。器件的P-I、V-I曲线见图 9。



正弦调制工作点的选择

对近 100 支用不同外延片制作的器件进 行实测结果得出:在 I_b=5~100 毫安范围

· 287 ·

内,器件的输出光功率-电流曲线具有良好线性。

所有器件,当 $I_b < 40$ 毫安时, V-I 关系 为非线性,只有在 $I_b \ge 40$ 毫安(对应的 V <1.55 伏)以后,V-I 关系呈现良好线性。大 多数器件在 $I_b \ge 25$ 毫安下(对应的 V < 1.5伏),V-I 曲线则有较好的线性。V-I 曲线 的斜率 $\frac{\Delta V}{\Delta I} = R_s$,其值通常为 2~3 欧姆, R_s 也称器件的动态电阻。

因此,器件的工作电流范围首先决定于 *P-I、V-I*特性的线性区和器件的最大耗散 功率。根据上述讨论,脉冲调制下*I*,最小值 应为30毫安左右,其最大值决定于公式(6) 和注入脉冲的宽度、占空比和*P*₀-*I*,曲线的 线性区。正弦调制下,(*I*_b+*I*_m)的值最好选 在30~100毫安范围内。

2. 调制带宽与注入载流子寿命

由图 2、4、5、6 等可见,器件的调制带 宽与注入电流的 1/2 次方基本上成线性关 系,而上升时间则随注入电流的增加近指数 衰减。这与按(4)、(5)两式所计算的结果相 符。

由公式(4)可知,调制带宽主要受注入到 有源区中的载流子寿命 τ 所限制, τ 减少, 4f 则增加。根据(5)式,在器件设计上,要使 τ 值减少,主要是减少有源区厚度 d,增加有源 区掺杂浓度 Po 和提高注入电流密度 J。但 是,它们的变化范围都是有限的。而且,对器 件的输出光功率和截止频率的影响来说,是 互相矛盾,相互制约的^{[41}。

本文只讨论给定范围的 d 和 Po下, Δf 与 J 的关系。从实验中所得曲线(见图 2~ 8)可知,如果单纯为了提高 fo,则采用高注 入是有利的。

3. 调制输出光功率和注入电流的关系

从图 3、7 和 8 可见, 调制输出光功率和 注入电流在一定范围内有近似线性关系。特 别是图 3 和 7 中, 这种线性关系比较明显。 图 8 中,由于 $\frac{I_m}{I_b}$ 的变化范围大,特别是当 $I_b 较小, I_m 较大 (如 M 接近 100% ---- M = \frac{I_m}{I_b} \times 100\%)$ 时,器件的 P-I、V-I 特性已完 全进入非线性工作区。在这种情况下,其频 率特性也会随之变化,所以表现出低 I_b 下 P_m 下降厉害,而高 I_b 下,器件输出光功率 接近饱和,整个 P_m-I_b 曲线的非线性较明 显。

图 7 中 P_m - I_m 的线性关系可这样解释。 首先,因为 $\frac{I_m}{I_b}$ 变化范围较小,因而器件频率 特性变化不大;即使在最大的 $\frac{I_m}{I_b}$ 下——图 7(a)中,在正弦电流的负半周,偏置电流的变 化范围是 5~20 毫安,落在 V-I 曲线的非线 性区里,所以其 P_m - I_m 关系看起来仍基本为 线性。其次,在图 7(b)、(c)、(d)中,器件都 工作于 P-I、V-I 特性的线性区,即使在正 弦电流的负半周里,偏置电流仍可达 25 毫安 以上,所以 P_m - I_m 仍具有线性。

一部分 P-I 线性差的器件在恒定 I_m 下, I_b 较大时, P_m 随 I_b 增加而下降,主要原 因是较大 I_b 下 P-I 曲线已进入亚线性区; 个别线性较好的器件 P_m 随 I_b 增加而下降, 是因为器件在不同 I_b 下频率特性发生变化, 即 I_b 增加频率特性变差,其原因至今仍不明 了。

4. 如何合理选择器件的工作点

根据上述讨论,器件工作点的选择主要 应依据 P-I、V-I 及 fo-I 曲线来确定。

脉冲调制下, I_p 最小值应为 30 毫安,最 大值主要取决于公式(6)所确定的器件耗散 功率及调制脉冲的宽度、占空比和 P_p - I_p 曲 线的线性范围。正弦调制下, I_b 、 I_m 的选取 一方面要保证(I_b + I_m +) $< I_{max}$,又要结合 P-I、V-I和 f_c -I等曲线来考虑。

根据上述实验结果,结合图 9 的分析,对 我们研制生产的 φ50 微米 DH LED 得出:

· 288 ·

正弦调制下,取 $I_b=62.5\sim70$ 毫安, $I_m=37.5\sim30$ 毫安较为合适。具体计算如下:从 图 9 中,得P-I线性范围为 $I=5\sim100$ 毫 安,V-I线性范围为 $I=25\sim100$ 毫安,综合 考虑取 $I=25\sim100$ 毫安,根据下式

 $\begin{cases} I_{b} + \frac{1}{2} I_{m(p \sim p)} = 100 \ \text{@} \mathcal{G} \\\\ I_{b} - \frac{1}{2} I_{m(p \sim p)} = 25 \sim 40 \ \text{@} \mathcal{G} \end{cases}$

得: $I_b = 62.5 \sim 70$ 毫安, $I_m = 37.5 \sim 30$ 毫安。 在这个工作点下,即使在正弦电流的负半周, 器件截止频率 f_o 仍可达 15 兆赫。

如增加 I_b , 减少 I_m , 则从图 9 可见, 器 件工作的动态范围将减少, 由此造成工作状 态不稳定; 反之, 减少 I_b , 增加 I_m , 即提高调 制度 M, 则当 $I_b - I_m < 25$ 毫安时, 器件工作 点将进入 V - I 曲线的非线性区, 由此将造成 在正弦负半周时的波形畸变的输出光功率明 显下降。

5. *t*, 和 *f*_c 的换算 绝大多数器件用(10) 式换算出来的 *f*_c

(上接第282页)

其增益区比前者要长得多。

图 3 中 P₂(J)各谱线的增益区长约 1 厘 米,这说明喷管出口下游 H₂ 和 F 原子两股 气流混合速度是很快的。根据 气动力学 计 算,喷管出口处气流速度可达 2000 米/秒,可 见,气流的混合在 5 微秒内即已基本完成。

增益测量结果表明, CL-9 喷管的混合 速度快,增益高,预期会有大的激光功率输 出。这已被实验所证实。

增益测量结果是检验理论模型计算正确 与否的重要数据,有关的计算正在进行。 值与小信号正弦调制下测到的 f_o 值有些 差别。例如GF211-A 20[#] I_p =50毫安时, t_r =20毫微秒,即 f_o =17.5兆赫; I_p =100 毫安时, t_r =14毫微秒,即 f_o =25兆赫。在 正弦调制中,取 I_b =50毫安, I_m =25毫安时, f_c =17.4兆赫; I_b =100毫安, I_m =25毫安 时, f_c =19兆赫。后者与脉冲调制法相差 6 兆赫,这可能是高幅度脉冲注入使耗尽的载 流子很快填满,从而使器件的辐射复合寿命 τ_r 缩短之故。

参考文献

- Henry Kressel, J. K. Butler; "Semiconductor Lasers and Heterojunction LEDS", 1977, p. 488, p. 71.
- [2] Kenji Ikeda; IEEE Transactions on Electron Devices, 1977, ED-24, NU7, p. 1001.
- [3] Alan Chappell; "Optoelectronics, Theory and Practice", 1976, p, 217~128.
- [4] Tien Pei Lee et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1978, QE-14, No. 3, 150~158.
- [5] [美]无线电公司编,史斯,伍琐译校;《电光学手册》, 国防工业出版社出版,1978年, p. 139.

参加工作的还有逢景科、闵祥德、李明 盛、桓长青等同志。崔铁基同志在信号测量工 作中曾给予不少帮助,特表谢意。

参考文献

- [1] R. A. Ohodzko et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1973, **QE-9**, 550.
- [2] R. A. Chodzko et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1976, QE-12, 660.
- [3] T. Yauo, H. M. Botitch; *IEEE J. Quant. Electr.*, 1978, **QE-14**, 12.
- [4] 黄瑞平,孙以珠;《中国激光》, 1983, 10, 250.

a se san and a se